



## ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง (Generalizability Theory)

### ความหมาย

เป็นทฤษฎีทางสถิติของการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผลการวัดในสถานการณ์ของการวัดผลลักษณะต่างๆ ที่เป็นเป้าหมายของการนำเครื่องมือไปใช้

### แนวคิดพื้นฐานของ G - Theory

G - Theory เชื่อว่าความคลาดเคลื่อนของการวัดเกิดจากหลายแหล่ง (Multiple error sources) ประกอบด้วยความคลาดเคลื่อนอย่างเป็นระบบ (Systematic source) และความคลาดเคลื่อนสุ่ม (Random source) ดังภาพ

$$\sigma_X^2 = \sigma_T^2 + \sigma_E^2$$

$\sigma_T^2$                        $\sigma_E^2$   
systematic                      random  
error variance                      error variance

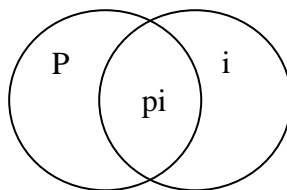
จากแนวคิดเกี่ยวกับ error variance ดังกล่าว G - Theory ได้เสนอวิธีวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลื่อนอย่างเป็นระบบจากแหล่งต่างๆ ที่เป็นสถานการณ์หรือเงื่อนไขของการวัด เช่น ความยาวของแบบทดสอบ ชุดของแบบทดสอบ จำนวนครั้งของการทดสอบ จำนวนผู้ตรวจ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอบกับเงื่อนไขของการวัด เช่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอบกับชุดของแบบทดสอบ ผู้สอบกับจำนวนครั้งของการทดสอบ เป็นต้น

ผลการวิเคราะห์ด้วย G - Theory จะให้ค่าสัมประสิทธิ์เชิงสรุปที่แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือของคะแนนที่ได้จากการวัด (Level of dependability) เรียกว่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง (Generalizability Coefficient : G - Coefficient) ซึ่งคล้ายกับค่าความเที่ยง (Reliability) ของทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม

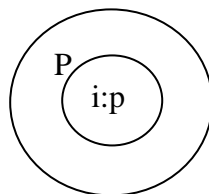
## การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลื่อน

การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลื่อนในการสอบแต่ละครั้งสามารถใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) แบ่งส่วนความแปรปรวน (Variance Component) ซึ่ง G - Theory มีการออกแบบการวัดเป็น 2 รูปแบบคือ

1. **แบบ Crossed Design** ตัวอย่างเช่น กรณีนี้นักเรียน (P) ทำข้อสอบ (i) เหมือนกันทุกข้อเรียกว่า **P x I Design** (ในตัวอย่างนี้เป็นแบบมีเงื่อนไขสรุปอ้างอิง 1 ฟ้า เซ็ท (Facet) หมายความว่าข้อสอบเป็นเอกภพของการสรุปอ้างอิง) สามารถเขียนเป็น Venn Diagram ดังนี้



2. **แบบ Nested Design** ตัวอย่างเช่นกรณีนี้นักเรียน (P) ทำข้อสอบ (i) จำนวนเท่ากันแต่ต่างข้อกันเรียกว่า **I : P Design** สามารถเขียนเป็น Venn Diagram ดังนี้



## การศึกษา G (G – Study) และ การศึกษา D (D – Study)

**การศึกษา G (G – Study)** เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนจากแหล่งความคลาดเคลื่อนต่างๆ โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)

### 1. กรณี 1 Facet P x I Design

SOV	SS	df	Ms	Variance Component
Person(p)	SSp	np-1	SSp/ dfp	$\sigma_p^2 = Msp - Mspi / ni$
Item(i)	SSi	ni-1	SSi/ dfi	$\sigma_i^2 = Msi - Mspi / np$
pxi	SSpi	(np-1)( ni-1)	SSpi/dfpi	$\sigma_{pi}^2 = Mspi$

## 2. กรณี 1 Facet I : p Design

SOV	SS	df	Ms	Variance Component
Person(p)	SSp	np-1	SSp/ dfp	$\sigma_p^2 = Msp - Msr / ni$
Residual (I :p)	SSR	np(ni-1)	SSR/ dfr	$\sigma_R^2 = Msr$

สรุปได้ว่าจุดประสงค์ของการศึกษา G คือ ต้องการประมาณค่าความแปรปรวนของคะแนนจริง ( $\sigma_p^2$ ) และความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลื่อนจากแหล่งความคลาดเคลื่อนต่างๆ ( เช่น  $\sigma_i^2, \sigma_{pi}^2, \sigma_R^2$  ) ที่สนใจ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนตัดสินใจในการศึกษา D เกี่ยวกับค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ

**การศึกษา D (D – Study)** เป็นการใช้ข้อมูลจากการศึกษา G ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์เพื่อตัดสินผลการประเมินซึ่งมี 2 แบบคือการตัดสินใจเชิงสัมบูรณ์หรือแบบอิงเกณฑ์ (Absolute Decision) และการตัดสินใจเชิงสัมพัทธ์หรือแบบอิงกลุ่ม (Relative Decision)

1. สัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงสำหรับการตัดสินใจเชิงสัมบูรณ์ ( $\sigma_{Abs}^2$ ) สัมประสิทธิ์นี้ บอกความเที่ยงของแบบทดสอบในสถานการณ์ของการตัดสินที่ขึ้นอยู่กับคะแนนของผู้สอบกับเกณฑ์ (ใช้ความแปรปรวนรวมทั้งหมดยกเว้นองค์ประกอบความแปรปรวนของบุคคล ในเทอมของ error variance :  $\sigma_e^2$ )

$$\sigma_{Abs}^2 = \sigma_i^2 + \sigma_{pi}^2 \implies \text{(ไม่ใช่ } \sigma_p^2 \text{)}$$

2. สัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงสำหรับการตัดสินใจเชิงสัมพัทธ์ ( $\sigma_{Rel}^2$ ) สัมประสิทธิ์นี้ บอกความเที่ยงของแบบทดสอบในสถานการณ์ของการตัดสินที่มีการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างผู้สอบภายในกลุ่ม (ใช้ความแปรปรวนที่ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในเทอมของ error variance :  $\sigma_e^2$ )

$$\sigma_{Rel}^2 = \sigma_{pi}^2 \implies \text{(ไม่ใช่ } \sigma_p^2, \sigma_i^2 \text{ เพราะไม่ใช่}$$

ปฏิสัมพันธ์)

## สัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง ( Generalizability Coefficient : G – Coefficient ( $\rho^2$ ))

หมายถึงค่าสัมประสิทธิ์เชิงสรุปที่แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือของคะแนนที่ได้จากการวัดคล้ายกับค่าความเที่ยง (Reliability) ของทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม ค่า G – Coefficient สำหรับการตัดสินใจแบบอิงเกณฑ์ (Absolute Decision) และการตัดสินใจแบบอิงกลุ่ม (Relative Decision) คำนวณได้จาก

$$\rho_{Abs}^2 = \frac{\sigma_p^2}{\sigma_p^2 + \sigma_{Abs}^2} = \frac{\sigma_p^2}{\sigma_p^2 + (\sigma_i^2 + \sigma_{pi}^2)}$$

$$\rho_{Rel}^2 = \frac{\sigma_p^2}{\sigma_p^2 + \sigma_{Rel}^2} = \frac{\sigma_p^2}{\sigma_p^2 + \sigma_{pi}^2}$$

สมการด้านบนเป็นกรณีที่มีข้อสอบเพียง 1 ข้อ หากต้องการสรุปอ้างอิงไปยังข้อสอบที่มีจำนวนข้อสอบ ( $n_i$ ) มากกว่า 1 ข้อให้เอาจำนวนข้อสอบหารเทอมของ error variance

$$\rho_{Abs}^2 = \frac{\sigma_p^2}{\sigma_p^2 + \frac{(\sigma_i^2 + \sigma_{pi}^2)}{n_i}}$$

$$\rho_{Rel}^2 = \frac{\sigma_p^2}{\sigma_p^2 + \frac{\sigma_{pi}^2}{n_i}}$$

จากสมการจะพบว่าค่าความเที่ยง (Reliability) หรือค่า G – Coefficient ( $\rho^2$ ) แบบอิงกลุ่ม ( $\rho_{Rel}^2$ ) จะมีค่าสูงกว่าแบบอิงเกณฑ์ ( $\rho_{Abs}^2$ ) เพราะแบบอิงกลุ่มมีความแปรปรวนในเทอมของ error variance น้อยกว่าแบบอิงเกณฑ์

## การออกแบบเอกภพสำหรับสององค์ประกอบ (Two - Facet Design)

### 1) การออกแบบ Two - Facet Crossed Design

POPULATION : Examinees or Persons (P)

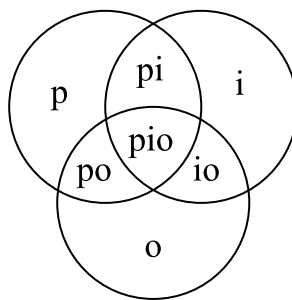
UNIVERSE : All possible combinations of conditions of the facets

FACET 1 : Items (I)

FACET 2 : Occations (O)

DESIGN : p X i X o design

VENN DIAGRAM :



$$\sigma_{X_{pio}}^2 = \sigma_p^2 + \sigma_i^2 + \sigma_o^2 + \sigma_{pi}^2 + \sigma_{po}^2 + \sigma_{io}^2 + \sigma_{pio,e}^2$$

เมื่อ  $\sigma_{X_{pio}}^2$  = ความแปรปรวนของคะแนนที่สังเกตได้

$\sigma_p^2$  = ความแปรปรวนของคะแนนเอกภพของผู้สอบ ( $\mu_p$ )

$\sigma_i^2$  = ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยรายข้อ ( $\mu_i$ )

$\sigma_o^2$  = ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยของการสอบแต่ละครั้ง ( $\mu_o$ )

$\sigma_{pi}^2$  = ความแปรปรวนของคะแนนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอบกับข้อสอบ

$\sigma_{po}^2$  = ความแปรปรวนของคะแนนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอบกับสถานการณ์ของการสอบแต่ละครั้ง

$\sigma_{io}^2$  = ความแปรปรวนของคะแนนปฏิสัมพันธ์ระหว่างข้อสอบกับสถานการณ์ของการสอบแต่ละครั้ง

$\sigma_{pio,e}^2$  = ความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลื่อนหรือส่วนที่เหลือ ( $e_{pio}$ )

## 2) การออกแบบ Two - Facet Nested Design

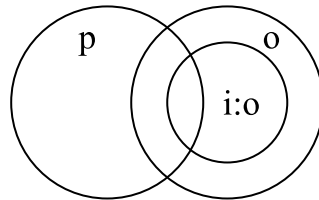
POPULATION : Examinees or Persons (P)

UNIVERSE : FACET 1 : Items (I)

FACET 2 : Occasions (O) และ i : o

DESIGN : p X (i : o) design

VENN DIAGRAM :



$$\sigma_{X_{p \times (i:o)}}^2 = \sigma_p^2 + \sigma_o^2 + \sigma_{i:o}^2 + \sigma_{po}^2 + \sigma_{pi:o,e}^2$$

ข้อมูลจาก รศ.ดร. ไพรัตน์ วงษ์นาม  
ศ.ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี